

**Ориентировочная стоимость услуг, оказываемых МРКЦП  
«Современные физико-химические методы формирования и исследования материалов для  
нужд промышленности, науки и образования»  
РГПУ им. А. И. Герцена  
(не является публичной офертой)**

<b>Наименование услуги</b>	<b>Ориентировочная стоимость, руб</b>
Анализ следов благородных газов (He, Ne, Ar, Kr, Xe) в геологических образцах	5100
Диэлектрическая спектроскопия	2250
Измерение метеорологических параметров	200
Измерение термодинамических характеристик и измерения изменения массы твердых и порошкообразных материалов	1000
Изучение строения различных объектов органической, элементоорганической и неорганической химии, включая определение состава многокомпонентных смесей методами ЯМР	1700
Исследование оптических свойств и структуры различных объектов органической, элементоорганической, физической и неорганической химии, диэлектрических, полупроводниковых материалов методами ИК-Фурье-спектроскопии	1000
Исследование структуры и элементного состава конденсированных сред методами растровой электронной микроскопии	3800
Исследования ИК-спектров с использованием Фурье-спектрометра IRPrestige-21	1000
Исследования кристаллической структуры методами рентгеноструктурного анализа	1000
Исследования методами дифференциальной сканирующей калориметрии	1900
Исследования методами спектрофлуориметрии	1000
Исследования состава и структуры геологических образцов методами анализа рентгеновской флуоресценции	1000
Исследования электрических свойств методом анализа термостимулированных токов	2300
Количественный неразрушающий анализ состава газообразных, жидких и твердых материалов методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии	1000
Формирование наноструктур методами электронной литографии	1900
Определение возраста методом радиоуглеродного датирования до 60000 лет	16000
Определение содержания радиоуглерода ( $C^{12}$ ), трития ( $H^3$ ) и других элементов в различных средах (вода, почва, биологические объекты)	5100
Формирование проводящих покрытий на диэлектрических материалах (в целях электронной микроскопии)	500
Определение морфологии поверхности методами атомно-силовой микроскопии	1000
Измерение мессбауэровских спектров	1000